

DIN 58002:2001-12 (D)

Integrierte Optik - Nahfeldmessverfahren für einmodige optische Chipkomponenten

Inhalt	Seite
Vorwort	1
Einleitung	2
1 Anwendungsbereich	2
2 Normative Verweisungen	2
3 Begriffe und Symbole	2
3.1 Begriffe	2
3.1.1 Signal	2
3.1.2 Signal-Rausch-Verhältnis SNR	2
3.1.3 Empfängersystem	2
3.1.4 Oberfläche des optischen Bauteils	2
3.1.5 Grundmode	3
3.2 Symbole	3
4 Prüfverfahren	4
4.1 Prinzip	4
4.2 Messaufbau	4
4.2.1 Allgemeines	4
4.2.2 Mechanischer Aufbau	4
4.2.3 Lichtquelle und Lichteinkopplung	4
4.2.4 Abbildungsoptik	5
4.2.5 Empfängersystem	5
4.3 Durchführung	6
5 Auswertung	6
5.1 Beschreibung der Modenfeldverteilung durch Gauß-Verteilungen	6
5.1.1 Modell für die Beschreibung	6
5.1.2 Korrelationskoeffizienten c_x und c_y	7
5.2 Bestimmung der optischen Strahlparameter	7
5.2.1 Festlegung des Auswertungsbereiches	7
5.2.2 Berechnung der Fleckgrößen in x- und y-Richtung	7
5.2.3 Berechnung der Bewertungsparameter c_x und c_y	8
6 Prüfbericht	8
Anhang A (informativ) Fehler bei der Nahfeldmessung durch die endliche numerische Apertur des Messobjektivs	9